

Produktbeschreibung (Übersetzung von New Wave Research Produktbeschreibung):

Die UP193-FX verfügt über Benchmark-Genauigkeit, Präzision und Strahlflatness bei geringen Betriebskosten - alles innerhalb des kleinsten Fußabdruckes der Branche. Der UP193-FX verfügt über einen vollständig homogenisierten Strahl, unübertroffene Wellenlängenkupplung zum ICP-MS und bis zu 4 GW/cm² Bestrahlung an der Probe. Das Ergebnis sind durchweg kleinere Aerosolpartikel aus allen Materialien für maximale Ionisation, minimale Fraktionierung und unübertroffene Kraterqualität. Dramatisch kompakter als konkurrierende Systeme, ist der UP193-FX ein überlegenes und flexibles Analysewerkzeug für Materialien, darunter: Gele, Flüssigkeiten, Quarz, biologische Gewebe, Bio, Kunststoffe, Keramik, Farbe und Glas. Es liefert auch überlegene Ergebnisse bei Metallen durch seine kürzere Pulsbreite über herkömmliche Excimer-Laser und eignet sich ideal für die Groß- oder Mikro-Feature-Analyse. Zu den Anwendungen gehören Geochemie, Grundlagen, Forensik, Bergbau, Gemmologie, Umweltwissenschaften, Archäologie, Pharma- und Gesundheitswissenschaften. Der UP193-FX verfügt auch über dreizehn vorkalibrierte Spotgrößen mit konstanter Energiedichte. Ein proprietäres Strahldesign mit Strahlhomogenisierungs-Optik sorgt weiter für flache, gleichmäßige Krater. Der Laser kann in einem konstanten Energiemodus betrieben werden, um einen minimalen Energiedrift über lange Ablationsläufe zu gewährleisten. Ein optionales optisches Strahlabschwächer erreicht eine gleichmäßige Ablation bei sehr niedrigen Energieniveaus mit verbesserter Laserstabilität für empfindliche Proben. Diese Strategie maximiert die Wertungseffizienz mit einem einfachen robusteren Design für verbesserte Zuverlässigkeit und Betriebskosten.

Der UP193-FX ist mit allen handelsüblichen ICP-Massenspektrometern kompatibel. Darüber hinaus bietet seine branchenführende Softwareplattform – ein Markenzeichen aller Laserablationslösungen für New Wave Research – ein breites Spektrum an Ablationsfunktionen, einschließlich Tiefenprofilierung, Beispiel-Mapping und Auto-Samplin.